

第5回研究会「高分解能STEM法の定量性とさらなる可能性」

おかげさまで定員60名を超えるお申し込みを頂きました。
誠に勝手ならら、お申し込みを終了させていただきます。

(会場スペースの都合で、お申し込みされていない方のご参加をご遠慮して頂くことがあります。)
ご理解のほど、お願い申し上げます。 2010年3月2日 告知

日時 2010年3月5日(金) 13:00-17:00

場所 東京駅 東京八重洲ホール 301 会議室

(定員60名 (会場スペースの都合上、定員にて、受付を締め切らせて頂きます))

会費 1,000円

趣旨

電子顕微鏡の高分解能化を目指し、電圧変動が小さく、かつ、電流が安定した電子線プローブの形成、収差のないレンズ系、振動やドリフトの少ない鏡体、そして、高感度の検出器の開発が精力的に進められてきた。このことは、電子顕微鏡の分解能を高めるに留まらず、顕微鏡像の定量解析や新しい顕微法への取り組みを触発している。今後、顕微鏡像の定量性に関する議論が活発になるだろう。本研究会は、定量解析や新しい顕微法に取り組まれている研究者の方々に、これまでの取り組みと今後の進展に関するお話を伺い、電子顕微鏡法のさらなる可能性について議論する。

13:05-13:10

「趣旨説明」

東京工業大学 谷城康真

13:10-14:00

「ADF像強度の散乱角依存性と定量解析の試み」

東京大学 阿部英司

14:00-14:30

「各種実験条件が高分解能STEM像に与える影響」

富士通研究所 山崎貴司、小高康稔

14:30-15:00

休憩

15:00-15:30

「収差補正STEMを用いた環状明視野法による軽元素サイトの直接観察」

日本電子(株) 奥西栄治、石川勇、沢田英敬、堀まどか、細川史夫、近藤行人

15:30-16:00

“Annular bright field scanning transmission electron microscopy”

Univ. of Tokyo S.D. Findlay, N. Shibata, H. Sawada, E. Okunishi, Y. Kondo, S. Azuma, T. Yamamoto, Y. Ikuhara

16:00-16:30

「シリコン結晶中のヒ素ドーパント原子検出」

東京工業大学 大島義文、橋本豊、澤田英敬、近藤行人、谷城康真、高柳邦夫

16:30-17:00

「総合討論」

(座長：前半 谷城康真、後半 阿部英司)

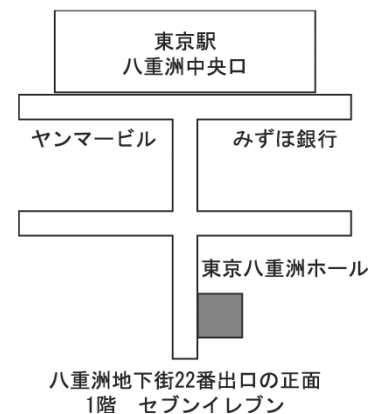
参加申し込み：下記世話人までメールでお願いします

第5回研究会世話人(問合せ先)：大島義文(東工大 院総理工)

TEL: 045-924-5619、E-mail: oshima.y.aa[a]m.titech.ac.jp

([a]は、@に直して送信してください)

分科会責任者 谷城康真(東工大 院理工)



アクセスマップ